

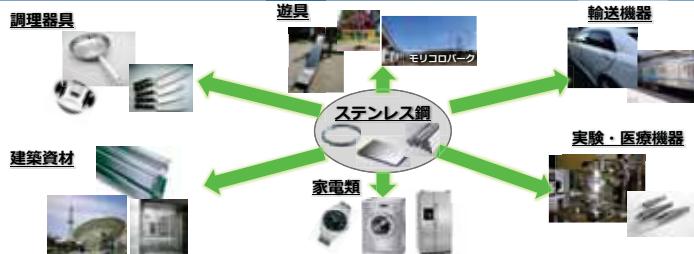
**DENSO**

# 放射光X線吸収および光電子分光を用いた ステンレス鋼不動態被膜の構造解析



株式会社デンソー ○伊東 真一・清水 皇・浅井 英雄

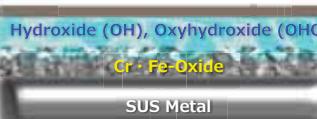
## ステンレス鋼



## 自然不動態被膜

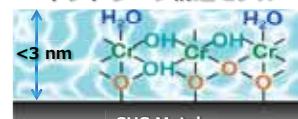
自然不動態被膜：大気中や水中で  
自然酸化により生成するCr/Fe化合物層

### バイレイヤーモデル



P. Marcus et al., Proceedings-Electrochemical Society, Vol.13, 2002.

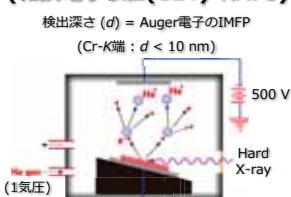
### ネットワーク構造モデル



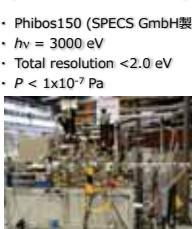
G. Okamoto, Corr. Sci. 13 (1973) 471.

## 実験条件

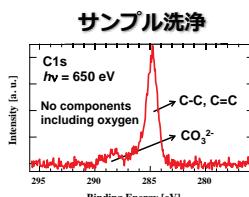
### BL5S1 (転換電子収量(CEY)-XAFS)



### BL6N1 (硬X線光電子分光)

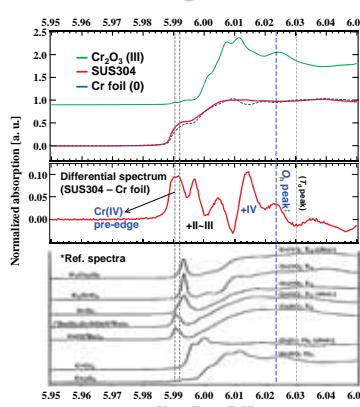


### BL7U (軟X線高分解能XPS)



研磨したSUS304基板をアセトン浴溶媒中で超音波洗浄。  
自然不動態被膜から表面の有機成分のみを選択的に除去。

### Cr-K edge XANES



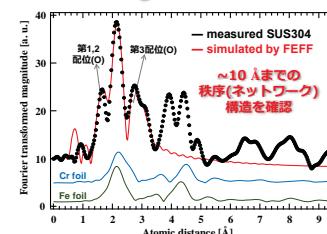
差スペクトル = 不動態被膜成分の電子状態

6配位(O<sub>h</sub>)-Cr(II, III, IV)化合物が存在

\*K.L. Fujii et al., J. Catal. 218 (2003) 123.

\*Y.G. Choi et al., Chem. Phys. Lett. 329 (2000) 370.

### Cr-K edge FT-EXAFS



#### FEFFシミュレーション 初期条件

Space group	Lattice Const. [Å]	Angle [°]
Passive film (CrO <sub>2</sub> /IV)	P42/mm $a = b = 4.421$ $c = 2.917$	90
Austenite-Fe	I43m 2.286	90

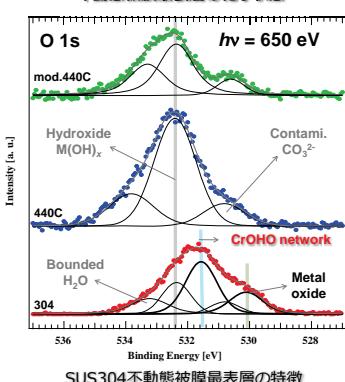
#### FEFFシミュレーション 結果(一部)

Scattering Path (single scatter)	Atomic distance [Å]	Cr <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	Passive film
Cr <sub>2</sub> -O <sub>3</sub>	1.88	1.91 (+1.6%)	
Cr <sub>2</sub> -O <sub>2</sub>	1.92	1.95 (+1.6%)	
Cr <sub>2</sub> -Cr <sub>1</sub>	2.92	2.95 (+1.0%)	
Cr <sub>2</sub> -O <sub>3</sub>	3.37	3.40 (+0.9%)	

## X線光電子分光

### 軟X線高分解能-XPS

-不動態被膜最表層の化学状態-



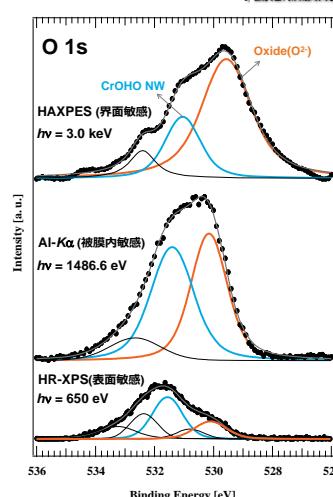
SUS304不動態被膜最表層の特徴

- 531.5 eV : オキシ水酸化物(OHO)由来のO 1sピーク\*  
⇒ CrOHネットワーク構造(CrO<sub>2</sub>の水和構造)
- 530 eV : 酸化物由来のO 1sピーク  
⇒ 不動態被膜最表層に酸化物が存在

\*I. Ikemoto et al., Solid State Chem. 17 (1976) 425.

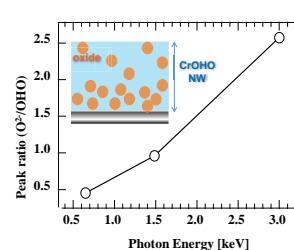
### XPS-入射エネルギー依存性

-不動態被膜成分の深さ方向分布-

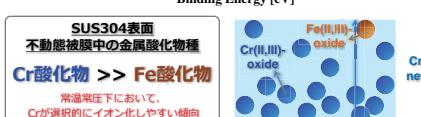
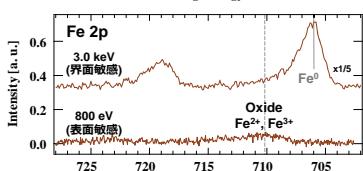
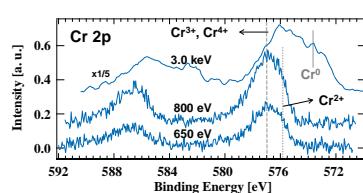


SUS304不動態被膜全体の特徴

- 不動態被膜/金属界面  
～被膜最表層まで  
連続的なCrOHネットワーク構造
- 界面領域: CrOH < Oxide



### -不動態被膜中酸化物の同定-



## まとめ

### SUS304-自然不動態被膜構造



SUS304-不動態被膜最表層

- O 1s HR-XPS : CrOHネットワーク
- Cr 2p HR-XPS : Cr<sup>2+~4+</sup>イオン

- SUS304の自然酸化不動態被膜は、不動態被膜 / 金属界面から被膜最表層に亘る一様な CrOHネットワーク構造と、ネットワーク中に分散するCr-rich酸化物から構成される。
- CrOHネットワーク構造においてCrは4価の状態で存在する。本研究は、不動態被膜分析においてCr(IV)化合物が観測された希少な例である。

## 謝辞

本研究における放射光測定におきましては、あいちシンクロトロン光センターの下記職員の皆様に大変お世話になりました。  
心より感謝申し上げます。



渡辺義夫様、吉村倫拓様、杉山陽米様、野崎彰子様

BL5S1 森本浩行様、廣友稔樹様

BL5S2 中西裕紀様、佐久間謙博様

BL6N1 村井崇章様、陰地宏様

BL7U 仲武昌史様

その他皆様